

# ÉRZÉKELŐK I

Dr. Pődör Bálint

Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet

## 2. ELŐADÁS: ÉRZÉKELŐK TECHNOLÓGIÁI: SPECIÁLIS ANYAGTÍPUSOK ÉS TECHNOLÓGIÁK



2010/2011 tanév 1. félév

1

## MIKROTECHNOLÓGIA, MEMS

Micro ElectroMechanical Systems

MEMS: a „2D” IC technológia → 3D szerkezetek

- membránok, felfüggesztett elemek, mozgó alkatrészek,
- mikrofluidikai alkalmazások: csatornák, üregek, reaktorok stb.

Mikromechanika:  
eljárások és eszközök: döntő többségében eltérnek a hagyományos mechanikai megmunkálásoktól elsősorban „száraz” ill. „nedves” kémiai marások és elektrokémiai módszerek de klasszikus eljárások is lehetnek (lézer, v. gyémánttárcsás vágás)

jellemző méretek: 1-500 µm

Si kristály vastagsága 380-500-1000µm  
Más anyagok is: GaAs, kvarc, stb.  
Tömbi- és felületi mikromechanika

## Si MIKROMECHANIKA

A Si alapú (mechanikai) érzékelők előnyös tulajdonságai  
Jól meghatározott elektromos tulajdonságok mellett  
rendkívül jó mechanikai tulajdonságok

Jelentős méretcsökkenés megvalósítása  
Tömeggyárthatóság  
integrálhatóság

	Si	Diamond	Steel	Al
Hardness (Kg/mm <sup>2</sup> )	850	7000	660-1500	130
$\sigma_{yield}$ (GPa)	7	53	42	0.17
Young's modulus (GPa)	160	1035	200	70
Thermal conductivity (W/cmK)	1.48	20-25	0.8	2.37

## EGYKRISTÁLYOS SZILÍCIUM

legtisztább anyag  
legtökéletesebb egykristály  
IC gyártás fő alapanyaga (még egy évtizedig biztosan)  
Si alapú szenzorika IGEN  
Si alapú fotonika ???

### Fontosabb adatok:

Kristályszerkezet:	fcc	14	2,328 g/cm <sup>3</sup>
rendszám:	28,09	5x10 <sup>22</sup> cm <sup>-3</sup>	
atomtömeg:	11,9		
tömegsűrűség:		1,48 W/cmK	
atomszűrűség:		p- vagy n-típusú	
reativ diel. állandó:		N <sub>d,a</sub> >10 <sup>17</sup> cm <sup>-3</sup> (~0,1 cm)	
hővezetés:		10 K cm - 1 m cm	
adálékolás:		300 mm (Intel),	
erős adálékoltság (p <sup>+</sup> , n <sup>+</sup> ):		75-100 mm (MTA MFA)	
erős adálékolás:			
failagos ellenállás:			
szeletátmérő:			

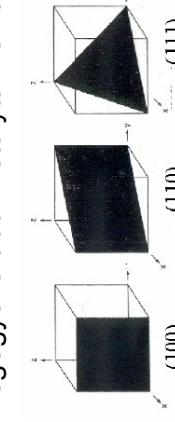
## Si MIKROMECHANIKA, MEMS

A szilícium alapú mikroszerkezetek és érzékelők kialakításának alapját a szilícium anizotropikus maratása jelenti: bizonys kémiail maratószerék (pl. KOH) az (100) és (110) orientációjú síkokat lényegesen gyorsabban marják, mint az (111) síkokat. Így az (100) felületi orientációjú Si szeletbe külön-féle, határozott geometriával rendelkező alakzatok marhatók. A szeletet először oxidálják, majd az oxidba ablakot nyitnak foto-litográfia és maratás útján. A szilícium kímarható azon részekben ahol az oxidréteg nem maszkolt. Anizotrópikus maratószerrel a felületre merőlegesen – (100) irányban- a maratás gyors, míg oldalirányban - az (111) irányban - pedig lassú. Így a maszk jellegétől függően "V" keresztmetszetű árok illetve fordított gúla alakú bemezők alkáthatók ki. A maratás felületre merőleges irányban lelassítható lassan maródó, un. "etch-stop" réteg (pl. egy erősen adalékolt p réteg) beépítésével.

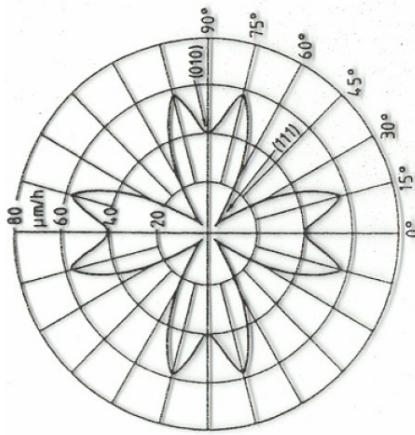
## MARÁSI SEBESSÉG IRÁNYFÜGGÉSE

Si – gyémánttárcs (lapcentrált köböös, fcc)

Legegyszerűbb kristálytani síkok

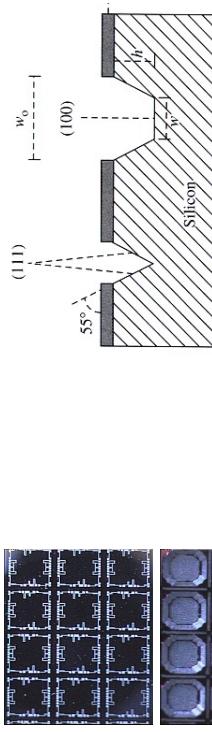


## MARÁSI SEBESSÉG IRÁNYFÜGGÉSE Si (100) KRISTÁLY

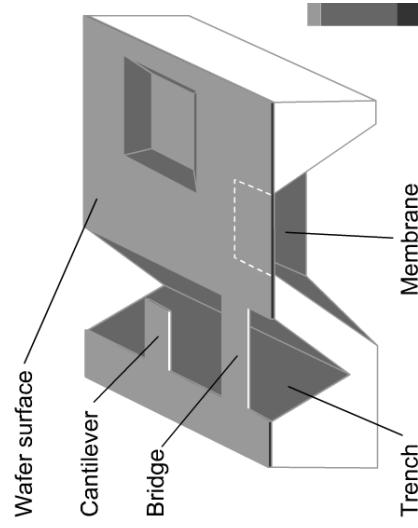


Alkáli, lúgos maró (pl. KOH), marási sebesség irányfüggő  
 $v(111) << v(100), v(110)$  (az arány néhány százszoros)

## TÖMBI MIKROMECHANIKA: KOH MARÁS – EGYSZERŰBB ALAKZATOK



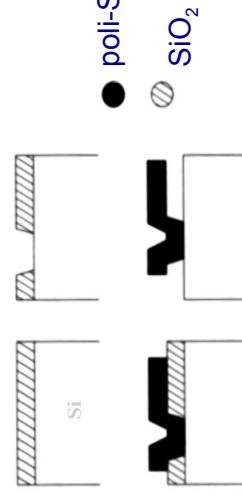
## TÖMBI MIKROMECHANIKA: TIPIKUS ALAKZATOK



## ANIZOTRÓP MARÁS: MARÁSI MÉLYSÉG BEÁLLÍTÁSA



## Si FELÜLETI MIKROMEGMUNKÁLÁS



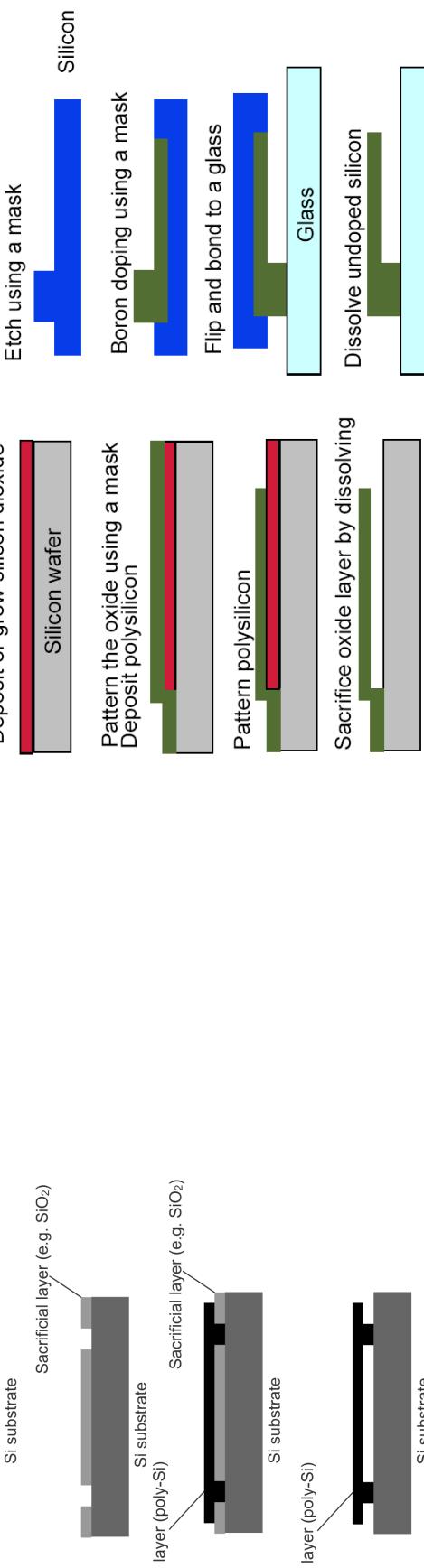
Marásmegállító réteg: erős p<sup>+</sup> adalékolás (B),  
néhány szor 10<sup>19</sup> cm<sup>-3</sup>

rezgőnyelv (vagy) membrán kialakítása rétegleválasztási és  
szelektív marási lépések megfelelő sorrendű alkalmazásával

## Si FELÜLETI MIKROMEGMUNKÁLÁS

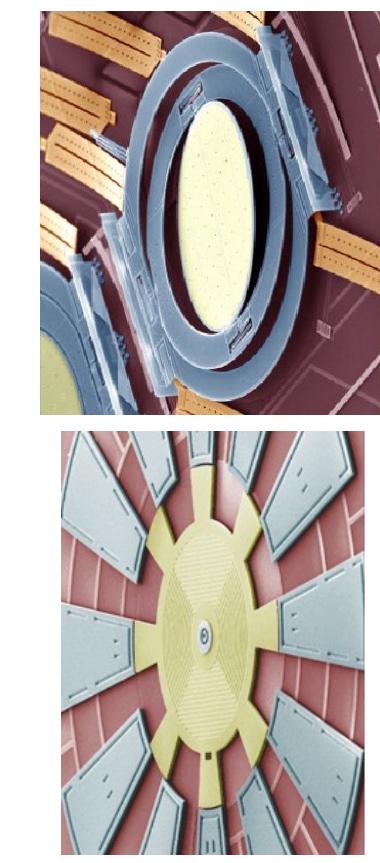
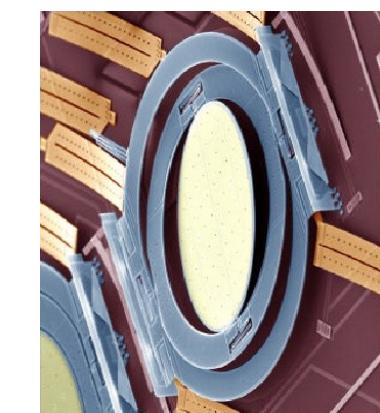
## FELÜLETI ÉS TÖMBI MIKROMEGMUNKÁLÁS

Deposit or grow silicon dioxide



## MIKRO-MOTOR ÉS MIKRO-TÜKÖR

## PIEOREZISZTÍV NYOMÁSÉRZÉKELŐ



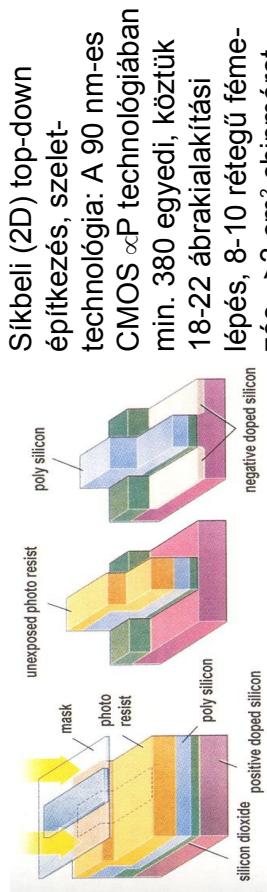
Si elektrosztatikus mikromotor (Texas Instruments)

Mikro-tükör (Lucent Technologies)

Chip: 2,67 x 2,67 mm

Membrán vastagsága < 25  $\mu\text{m}$

## CMOS ÉS MEMS TECHNOLÓGIA



## Si TECHNOLÓGIA

Alapanyag: félvezető egykristály (Si)

Processzálás:

•**Additív módszerek:**

ábrakialakítás  
vékonyréteg leválasztás – PVD, CVD,

•**Módosító eljárások:**

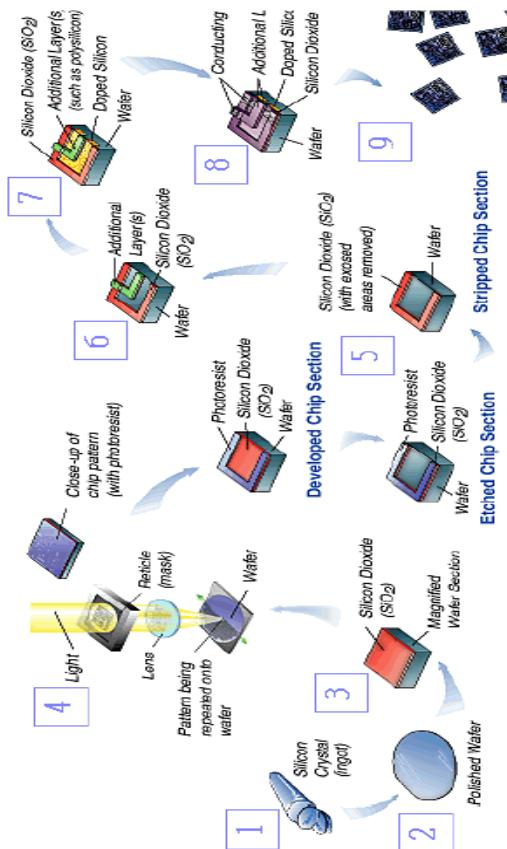
fotoexpozíció, ionimplantációs adalékoltás, termikus műveletek

•**Szubtraktív módszerek:**

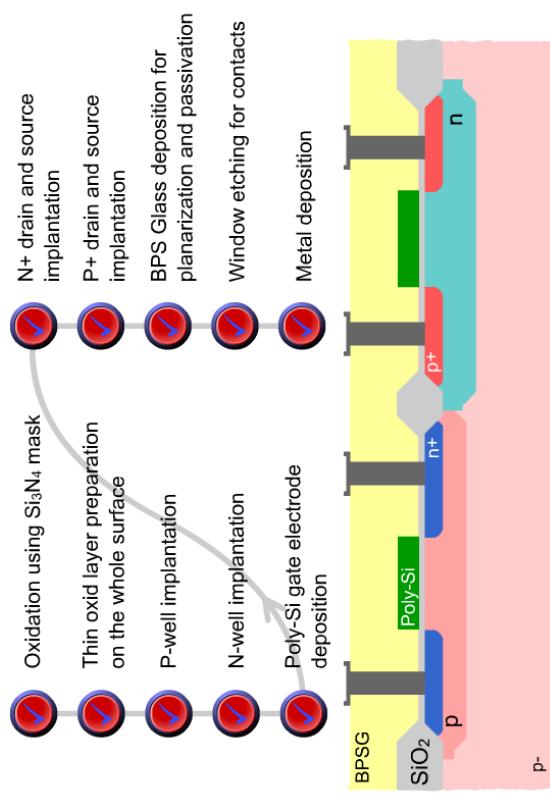
kémiai és fizikai marási lépések, lézeres és mechanikai rétegeltávolítás

A fentiek és kombinációik szekvenciális alkalmazása az alapanyag-szeleleten szellettechnológia

## Si IC TECHNOLÓGIA FŐBB LÉPÉSEI



## CMOS TECHNOLÓGIA VÁZLATA



## SZENZOROK: FÉLVEZETŐ TECHNOLÓGIÁK

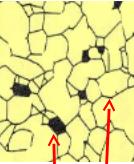
- ☺ Azonos karakterisztikájú elemek olcsó tömeggyártása
- ☺ Kisméretű, kis disszípaciójú eszközök
- ☺ Érzékelők integrációja
- ☺ Mikromechanikai és áramköri elemek és funkciók integrálása
- ☺ Elektromos paraméterek erősen hőmérsékletfüggőek
- ☺ A technológia nagy tisztaágat és bonyolult, költséges berendezéseket igényel
- ☺ Számos, az érzékelőkben használt anyag technológiailag nem kompatibilis a félvezetőkkel
- ☺ A szükséges tokozási eljárások drágítják az eszközöket

## TECHNOLÓGIÁK ÉS ANYAGOK:

- 1. Monolit félvezető technológiák
- 2. Kerámia technológiák
- 3. Rétegtechnológiák (vékony- és vastagréteg technológiák)
- 4. Polimer technológiák
- 5. Szálóptikai technológiák

## KERÁMIÁK

Polikristályos kerámiák: összetett szerkezet  
Pörusok  
szemcséhatárok  
külböző fázisok



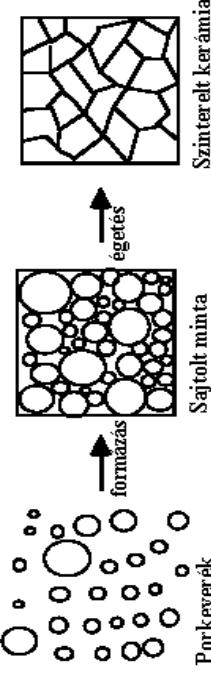
Ezek okozzák a különféle tulajdonságokat

## KERÁMIÁK SZERKEZETE

**Polikristályos anyagok**  
**Kristályos fázisok:** különböző összetétel, méret, kristályszerkezet → mechanikai és villamos tulajdonságok

**Üveges fázis:** → szilárdság, ridegség, átütési szilárdság  
**Gáz fázis:** → rugalmasság, hőszigetelés

A fázisok egymáshoz való viszonya szabályozható az összetételekkel és a technológiával



Szinterelt kerámia

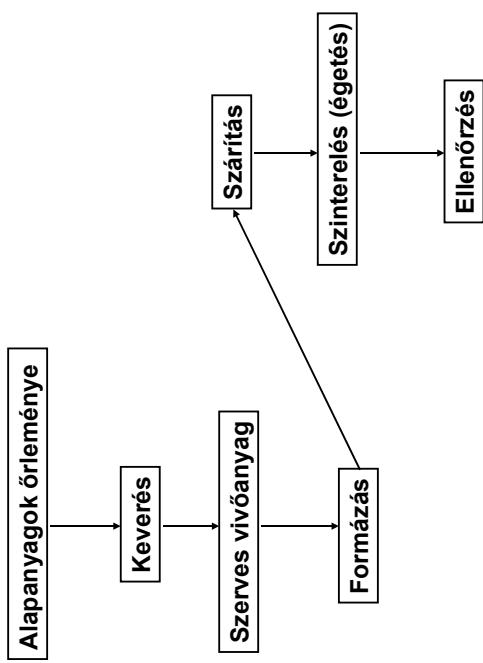
Sajtolt minta

Porkeverék

## TECHNOLÓGIA LÉPÉSEI

1. Homogenizálás: nyersanyagok + víz + kötőanyagok
2. Formázás: pl. gépi formázás, sajtolás, stb.
3. Hőkezelés: száritás
4. Égetés: az o.p. (K) 80 – 90%-án, nedvesség, kötőanyag eltávozása, polimorf átalakulás, átkristályosodás, szilárd fázisú reakciók, hőbomlás, tömörökés, zsugorodás
5. Mechanikai utómunkák

## KERÁMIATECHNOLÓGIA FOLYAMATSORA



## KERÁMIATECHNOLÓGIÁK A SZENZORIKÁBAN

Előnyök és hátrányok

- ☺ Diszkrét elemek nagy sorozatban olcsón
- ☺ Sokféle anyag (széles választék) feldolgozható
- ☺ Nem igényel nagytípuságú munkahelyet
- ☺ Magas hőmérsékletek szükségesége drágító tényező
- ☺ Integrálás nem vagy nehezen realizálható
- ☺ Csak nagy sorozatban gazdaságos
- ☺ Nem kompatibilis, illetve nehézen tehető kompatibilissá más technológiákkal

## TECHNOLÓGIÁK ÉS ANYAGOK:

1. Monolit félvezető technológiák
2. Kerámia technológiák
3. Rétegtechnológiák (vékony- és vastagréteg technológiák)
4. Polimer technológiák
5. Száloptikai technológiák

# RÉTEGTECHNOLÓGIÁK

## RÉTEGTECHNOLÓGIÁK

A rétegtechnológiák két csoportja:  
a vékonyréteg és a vastagréteg technológia.

Ezek az alkalmazott rétegvastagságában, az anyag típusában és a rétegfelvitel technológiájában különböznek egymástól.

A rétegleválasztási és litográfiai módszerek egy speciális kombinációja az un. **LIGA** (**Litographie, Galvanoformung, Abformung**) technológia, amely lehetővé teszi több száz mikrométer vastag, öntartó, 3 dimenziós elemek kialakítását.

Az ideiglenes "áldozati" réteget is tartalmazó változat az **SLIGA** technológia.

## VÉKONYRÉTEGEK LEVÁLASZTÁSA

Fizikai módszerek (PVD, Physical Vapour Deposition)  
szilárd forrásból:  
párologtatás (vákuum)  
porolasztás (rf, magnetron)  
MBE (Molecular Beam Epitaxy)

Kémiai módszerek  
elektrolitból: galvanizálás  
oldatból, szuszpenzióból: lecsapatás, szol-gél technika  
gázfázisból: CVD (Chemical Vapour Deposition)  
VPE (Vapour Phase Epitaxy)  
MOCVD (Metal Organic ...)  
LPCVD (Low pressure...)  
PECVD (Plasma enhanced...)  
MWCVD (MicroWave...)  
PACVD (Photon assisted..., néha plasma assisted)  
ALCVD (Atomic Layer.. ALD(ep..), ALEpitaxy)

A klasszikus vastag- és vékonyréteg technológia összehasonlítása

Vékonyrétegek	Vastagrétegek
Nagyfeszültséges, ötvözeteik, vegyületek	Nagyfeszültsaságú fémek, ötvözeteik, vegyületek
Vákuumbeli leválasztás, CVD	Kolloid szuszpenziók
10-200 nm	10-50 $\mu$ m
Polikristájos, nem teljesen összefüggő	Szinterelt aktív szemcsék kötőanyag mátrixban

## VASTAGRÉTEGEK LEVÁLASZTÁSA

Alaptechnológia: színtanyomtatás + hőkezelés  
CERMET vastagréteg-technológia:  
szervetten (üveg, üveg-kerámia, kerámia-fém-üveg)  
kompozit alapanyagok  
Relatíve magas beégetési hőmérséklet

Polymer vastagréteg-technológia:  
Polymer bázisú anyagok  
Relatíve alacsony hőkezelési hőmérsékletek

# RÉTEGTECHNOLOGIÁK: ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK

- ☺ Viszonylag olcsó, kissorozatú gyártás is
- ☺ hibridizálhatóak
- ☺ Bizonyosfokú integráció lehetséges
- ☺ Többféle hordozó – többféle réteg
- ☺ Igen sokféle anyagú réteg vihető fel
- ☺ Többrétegű szerkezetek

☺ Nagybonyolultságú és nagyfokú integráció nem realizálható

## LIGA

Rétegleválasztási és litográfiai módszerök speciális kombinációja:

**Litographie, Galvanoformung, Abformung – LIGA**

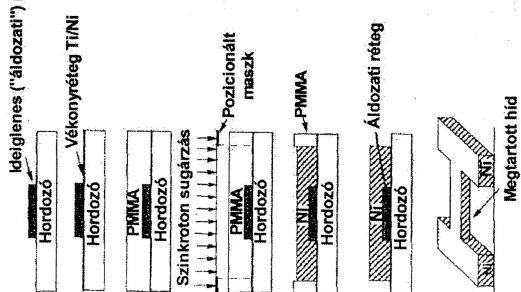
Áldozati (sacrificial) réteget is beiktatva – SLIGA, ezzel részben szabad, rugalmasan felügyesztett, illetve teljesen szabad elemek készíthetők.

Speciális követelmények:

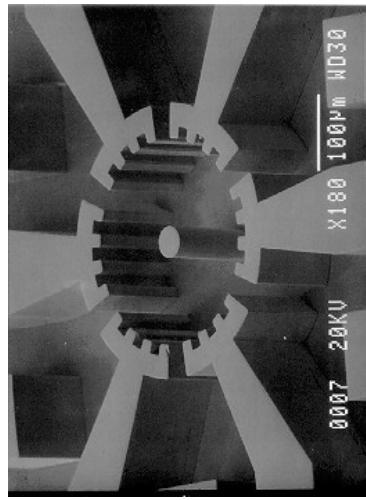
Röntgen sugarforrás (szinkrotron)  $E > 1 \text{ GeV}$ ,  $\lambda < 0,7 \text{ nm}$   
Vastag reziszt, tipikusan PMMA (poli-metil-metakrilát)

Fő előny: 3D mikrostruktúrák, melyek vastagsága hasonló a tömbi mikromechanikai elemekhez, de a felületi mikromechanika nagyobb flexibilitása megtartásával.

## SLIGA TECHNOLOGIA



## LIGA EXAMPLES



- 0007 20kV X180 100µm WD30
- 200nm deep structures
- Coat with thick resist
- Pattern with X-rays
- Electroplate exposed area with Ni
- Machine to +/- 5cm
- Use titanium and Cu as sacrificial layers

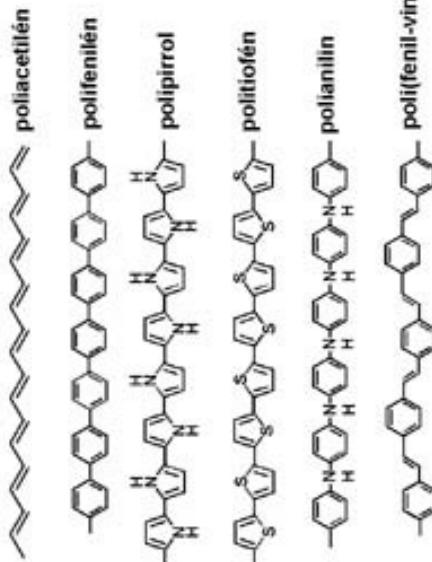
## TECHNOLÓGIÁK ÉS ANYAGOK:

### POLIMEREK: ALAPFOGALMAK

<b>Természetes polimerek:</b> Poliszacharidok (Keményítő, cellulóz) Polipeptidek, fehérjék Kaucsuk, gumi	$\text{H} \text{ H}$ $+ \text{C} - \text{C} +_n$ $\text{H} \text{ H}$	Poli-étilén, PE
<b>Mesterséges polimerek:</b> <b>műanyagok</b>	$\text{H} \text{ H}$ $+ \text{C} - \text{C} +_n$ $\text{H} \text{ H}$	Poli-propilén, PP
Monomer: építőegység Polimer: tökép szénlánc, különöző oldalágakkal	$\text{H} \text{ H}$ $+ \text{C} - \text{C} +_n$ $\text{H} \text{ Cl}$	
Polymer: monomeregysségből áll. Homopolimer: egyfajta monomeregysségből felépülő makromolekulák Kopolimer: két- vagy többfajta monomeregysségeket tartalmazó	$\text{H} \text{ H}$ $+ \text{C} - \text{C} +_n$ $\text{H} \text{ Cl}$	Poli-vinilklorid, PVC
		Poli-sztirol, PS

A makromolekulák súlya nagy. Egzakt határ nincs, 5000-10000 mólsúly felett szokás makromolekulákról beszélni, mert ezen mólsúly érték körül jellemzők még a polimerekre jellemző, minőségileg új tulajdonságok (rugalmasság)

## VEZETŐ POLIMEREK



## POLIMER RÉTEGEK

Mikrotechnológiával kompatibilis rétegleválasztási technológiák

Fényérzékeny (UV) polimerek (pl. fotoreziszt): fotolitográfiai felvitel és alakzat kialakítás. Rutin IC technológia, közvetlenül átvihető a szennyezőkába is.

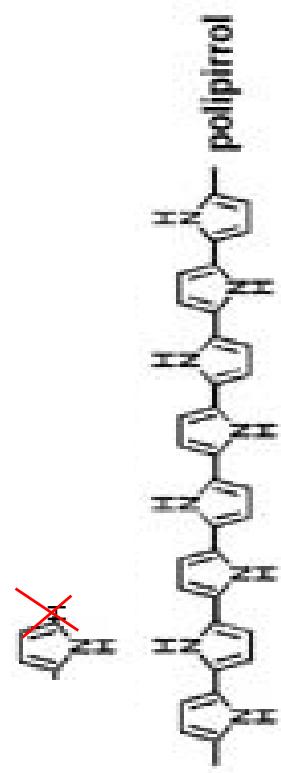
Szítanymás és hőkezelés: paszta formájában rendelkezésre álló polímer kompozit anyagok esetén: polímer vastagréteg technológia.

Vezető és félvezető polimerek: szintézis vezető felületen monomer oldatokból elektrokémiai polimerizációval.

Polímer vékonýrétegek: vákuumban végzett leválasztás a szokásos eljárássok valamelyikének megfelelő adaptálásával.

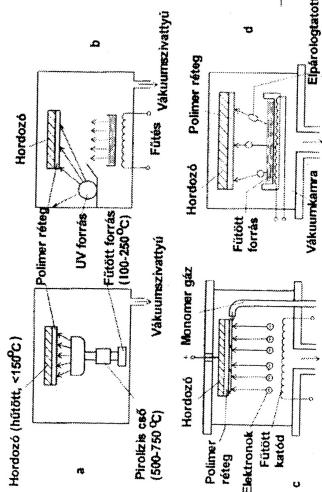
## ELEKTROKÉMIAI POLIMERIZÁCIÓ

Monomer: gyűrűs (aromás) vegyületek  
Elektrokémiai reakció (elektrokémiai oxidáció): H kiszakítása és a gyűrük közötti kötés létrejötte.



Pirofizzsel inicializált polimerizáció:  
szublimáció + pirofíz +  
kondenzáció/polimerizáció: H

UV-sugárzással segített  
vákuum polimerizáció

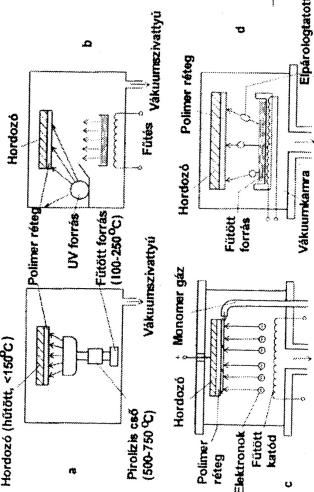
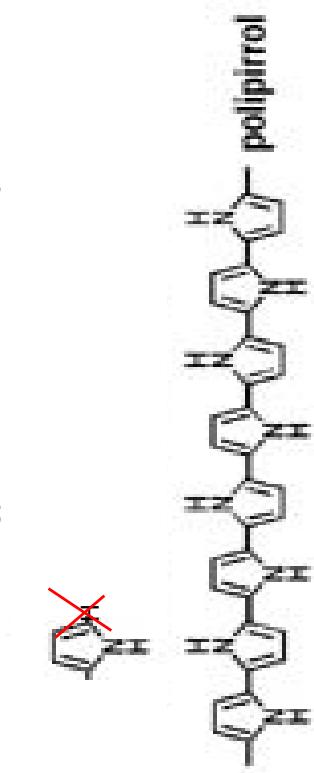


Elektronbombázással segített  
vákuum polimerizáció

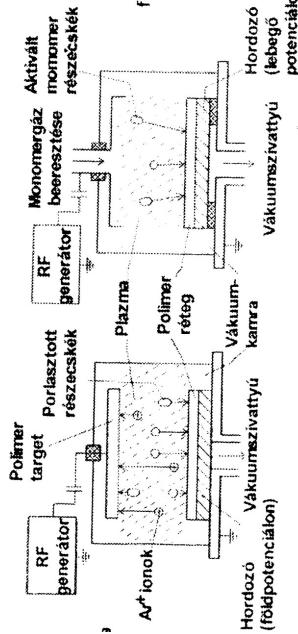
Vákuumpárolgatás ellenállásfűtésű vagy  
elektronbombázott polímer forrásból

## POLIMER VÉKONYRÉTEGEK LEVÁLASZTÁSA

Monomer: gyűrűs (aromás) vegyületek  
Elektrokémiai reakció (elektrokémiai oxidáció): H kiszakítása és a gyűrük közötti kötés létrejötte.



## POLIMER VÉKONYRÉTEGEK LEVÁLASZTÁSA



RF portásztás polímer  
targetból

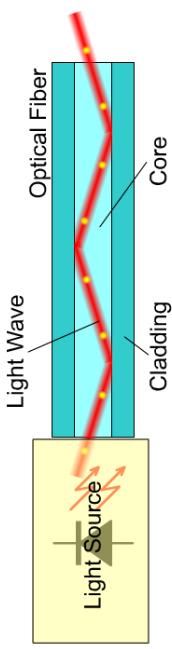
Plazma polimerizáció  
monomer gázokból vagy  
gőzökiből

## TECHNOLÓGIÁK ÉS ANYAGOK:

1. Monolit félvezető technológiák
2. Kerámia technológiák
3. Rétegtechnológiák (vékony- és vastagréteg technológiák)
4. Polímer technológiák
5. Száloptikai technológiák

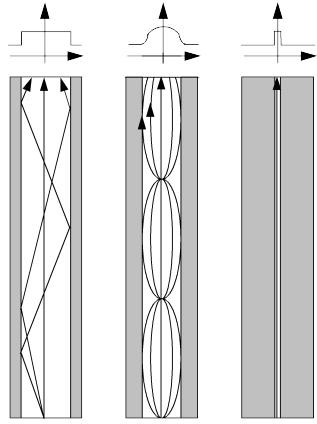
## OPTIKAI SZÁLAK ÉRZÉKELŐKBEN

Az optikai (fényvezető) szálak érzékelők működésére azon alapul, hogy az érzékelendő paraméter változásait az átvezetett vagy visszavert fényhullám jellemzőinek (intenzitás, polarizáció, fázis, módusösszetétel, frekvencia) megváltozása kíséri.



A szilárd, kör-keresztmetszetű fényvezető magot egy kisebb törésmutatójú héj veszi körül. A határfelületükön fellépő teljes visszaverődés biztosítja a fényvezetést a magon belül.

## OPTIKAI SZÁLAK FAJTÁI



A fényvezető szálak működésének fizikai alapja a teljes visszaverődés. A szálban a mag törésmutatója nagyobb mint a héj törésmutatója. Többmóodusú lépcsős indexű, többmóodusú gradiens indexű, és egymóodusú lépcsős indexű száltípusok

## ANYAGOK

Csillapítás: függ a szál anyagától, szennyezőktől, szerkezeti hibáktól, stb.  
Nagyításigényű anyagokra van szükség.

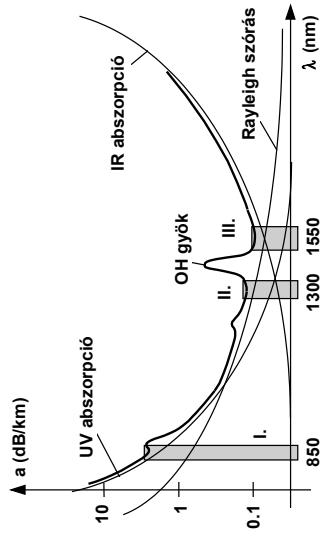
Anyagok:

Kvarcüveg  
Poli-metil-metakrilát (PMMA)

Integrált optikai szerkezetekben:

Szilícium, vegyület-félvezetők, litium-niobát ( $\text{LiNbO}_3$ )

## CSILLAPÍTÁS HULLÁMHOSSZFÜGGÉSE



Fényvezető szál (olvasztott kvárc,  $\text{SiO}_2$ ) csillapítási karakterisztikája. Átvitelű "ablakok": I. – 850 nm, GaAs lézer, II. – 1200-1300 nm, minimális diszperzió, InGaAsP/InP lézer, III. 1540-1450 nm, minimális csillapítás, InGaAsP/InP lézer.

## ÜVEGSZÁL ALAPANYAG

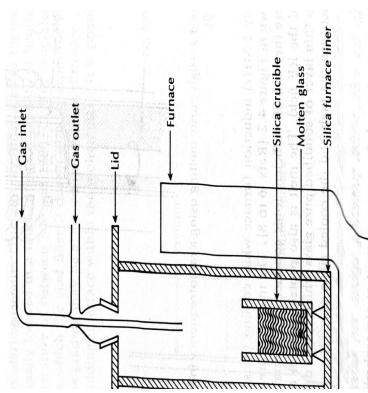
Tiszta oxidporok SiO<sub>2</sub>, GeO<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> előállítása (tisztításuk szűréssel, párlással)

Olvasztás 900-1300 °C között, és rúd formálása

Törésmutató (n) módosítása anyagi összetétel változtatásával

Tégely platinából, hogy ne szennyezze az üveget

SiO<sub>2</sub> tégely inhomogenitást okozhat a szálban, ezért gázzal hűti a tégelyt, ami egy vékony, szilárd üvegréteget hoz létre

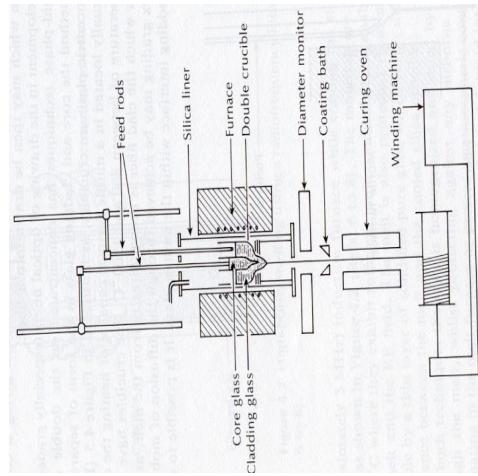


Két tégely a mag és a héj számára

GI szál gyártása

800-1200 °C

Olvadt üvegből iondiffúzióval oldják meg a törésmutató változtatását



Üvegszál húzása kétféle módszerrel

## ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK

- ☺ Kis jelcsillapítás és nagy adatkapacitás
- ☺ Kompatibilitás az optikai adattáviteli rendszerekkel
- ☺ Érzéketlen az elektromágneses zavarokra (nem kell árnyékolás, zavarzsűrés)
- ☺ Korroziómentesség és biokompatibilitás
- ☺ Flexibilitás fizikai és átvitt ételemben is. A szál már a gyártáskor beépíthető a vizsgálandó szerkezetbe. A kvarc optikai szál ellenáll szélsőséges viszonyoknak is, kb. 1000 °C-ig sem térfogatát sem sulyát nem változtatja meg. Az érzékelést végző optikai szál beönthető pl. betonba, a fémek egy részébe is
- ☺ Általában drágábbak mint az elektromos vagy elektromechanikus érzékelők. Költségnövelő, hogy a fényszál típusú érzékelőket még nem gyártják nagy sorozatban
- ☺ Nem vagy nehézen biztosítható a mikroelektronikai technológiákkal való kompatibilitás.

## OPTIKAI ÜVEGSZÁL

Lásd a következő oldalon leírtakat a tiszta üvegszál előállításának folyamatáról.